講義ノート

Ⅰ. 固体表面の電子論

北大触媒研究所 戸谷富之

- 目 次
- §1. 金属表面における電子密度分布
 - (1) Spreading effect
 - (2) Smoothing effect
- § 2. 表面準位
 - (1) Zone boundary での表面準位
 - (2) 遷移金属の表面準位
- § 3. Photoemission electron spectroscopy (PES)による表面準位及び水素吸着の電子状態
 - (1) タングステン(100)面の電子スペクトル
 - (2) 水素の吸着による電子スペクトルの変化

§ 4. 吸着理論

- (1) Anderson modelによる吸着理論
- (2) Configuration Interaction (CI) による吸着理論
- (3) Schrieffer の吸着理論
- (4) 吸着の電子スペクトル理論
- § 5. 二つの吸着状態と吸着による電気抵抗変化
 - (1) 薄膜の電気抵抗変化
 - (2) 金属薄膜の吸着による電気抵抗変化の実験例
- § 6. 白金電極の吸着による光の反射率の変化
- §7. 吸着水素のNMR

はじめに

固体表面に関する研究はかなり古くからなされて来た。金属と電解質溶液との界面にで きる Helmholtzの電気二 重層は 1879 年に, Gibbs の吸着の熱力学的研究は 1888 年の ことである。固体の仕事関数なる概念の萌芽はMillikan が Einstein の光電効果から Planck の定数 h を実験から直接きめようとしたとき(1913 年)からはじまる。電球 や二極管, 三極管に関して, 基礎的な吸着や仕事関数の研究が広範囲に行なわれはじめ たのは, Langmuir を中心として1915 年頃からである。電界電子放射の Fowler – Nordhe im の式は1928年に, 電熱子放射の Richardson – Dushmanの式は1923年 にそれぞれ導びかれた。

Lennard – Jones は古典的な原子・分子論から吸着の研究を行った。こうした研究 から吸着が固体表面の触媒作用や電極反応に主な役割を果すという認識から, Rideal, Polanyi, Frumkin, Horiuti, Emmett 等によって, 1930年代から広範囲な研 究がなされた。

固体表面の主な対象は、

- (a) 金属表面の電子の密度分布
- (b) 固体表面の表面準位
- (c) 表面による電子の多重散乱
- (d) 表面 プラズマ
- (e) 半導体表面の電子状態
- (f) 固体表面の格子振動
- (g) 固体表面による原子・分子散乱
- (h) 吸着および触媒作用

等であるが、今日お話しするのは、金属表面の電子論(a)(b)、特に(h)についてである。

§1. 金属表面における電子密度分布

金属の仕事関数は、金属のフェルミ面から一個の電子を外にひきだすのに必要な仕事 で、主に寄与する部分は、(1)金属のバンド構造によるものと、(2)電子密度分布が一様な 分布をしている内部とは異なって、表面では、一様でなく電気二重層ができるための部 分との和で与えられる。この電気二重層は、以下に説明するように spreading effect (滲みだし効果)と smoothing effect (ならし効果)によるものである。

(1) Spreading effect (滲みだし効果)

Bardeen ¹⁾ により 1936年にはじめて論ぜられたものである。

電子密度分布が一様に ρ₀ である金属を割って表面を作ったと考えられる。 図1に. 示すように縦の破線の所に新しい表面ができると、表面の近傍では電子の密度は、内

(1)

部から外部に滲みだし、表面内部は正に、外部は負になって、二重層が形づくられ仕 事関数は大きくなる。表面近傍の詳しいことは文献 2)に譲るが、 簡単なモデルとし て、よく次のようなものが用いられる。即ち、表面に垂直な方向を Z軸にとって、



図1. 電子密度分布と電気二重層

$$\rho(Z) = \rho_0 - \frac{1}{2}\rho_0 \exp(\beta Z) \qquad (Z < 0)$$

$$\rho(Z) = + \frac{1}{2} \rho_0 \exp(-\beta Z)$$
 (Z>0)

5

ここで、 β は定数で、表面エネルギーを極小にするようにきめる。 表面エネルギーは、 β の関数として

$$\mathbf{E}_{s}(\beta) = \mathbf{A} \frac{\rho_{0}^{\frac{3}{3}}}{\beta} \left\{ \frac{1.2}{2^{\frac{5}{3}}} - 1.585 \right\} + 0.6 \mathbf{B} \rho_{0} \beta \cdot 2 \ln 2$$

+
$$\frac{\rho_0 V_0'}{2\beta} \exp(-\beta Z_B) + \frac{\pi B^2 \rho_0^2}{2\beta^3}$$
 (2)

で与えられる。ここで,

$$A = \frac{4\pi h^2}{5m} \left(\frac{3}{8\pi}\right)^{\frac{5}{3}} , \quad B = \frac{h^2}{32\pi^2 m}$$
(3)

 V'_0 は滲みだす前の金属電子のポテンシャル、 Z_B はポテンシャル壁までの距離である。

井戸型のポテンシャルの壁の位置は、ポテンシャルの大きさが無限大のときは、図 1 で $\rho = 0$ になる Z = Z_Bの所であるが、ポテンシャルの深さが $\xi_0 + \phi(\xi_0)$ はフェ ルミ準位の運動エネルギー、 ϕ は仕事関数)のときは、壁の位置は、²

$$Z_{B}k_{F} = \frac{3}{4} \left\{ \frac{\pi}{2} + \left(\frac{\phi}{\xi_{0}} - 1 \right) \sin^{-1} \sqrt{\frac{\xi_{0}}{\xi_{0} + \phi}} - \sqrt{\frac{\phi}{\xi_{0}}} \right\}$$
(4)

となる。 k_F はフェルミ準位の電子の波数である。

(2) Smoothing effect (ならしの効果)

金属表面の(100), (110), (111) 面等では, 仕事関数がかなり異る。 (1)に 述べた spreading effect の大きさは面によってあまり違いはないが, ここに述べ る smoothing effect によって, 面によって仕事関数が大きく変ることは Smoluchowski³⁾ により1941年に説明された。



図2 電子密度の smoothing (a) W(100) 面 (b)W(110) 面

単純立方格子の(100)面と(110)面を例にとる。図2で、(a)は(100)面で、

表面に沿っては,滑らかに分布していて smoothing はおこらない。しかし, (b)の(110)面は面をつくる前は点線のように角ばった分布していたのが,面をつくると, smoothing をおこし実線の如くなる。 smoothing は正の二重層を作るので,仕事 関数を減少させる。

表1に、タングステンの単結晶面の仕事関数をあげておく⁴⁾ Smoluchowski の理 論値は最下段に示してある。

> 表1 Field Emission によるWの単結晶面の仕事関数(Solid State Surface Science(M. Dekker, Inc. N. Y. 1969) Vol. 1. Chapter 4.)と Smoluchowskiの計算結果(φ_{cal} は(111)面の仕事関数を基準にしている)単位 eV.

	110	111	112	100
Drechsler and Müller	5.70			
Houston		1.00		4.71
Müller	5.70-	4.39	4.65—	
	5.99		4.88	
Young and Müller	5.96			
Van Oostrom		4.40		
Holscher		4.40		5.2
Best estimate	5.84	4.40		
	± 0.05	± 0.01		
φ_{cal}	>4.78	4.40	4.62	4.61
	1	1	1	

§ 2. 表面準位

Tamm⁵(1932年)は、表面近傍のポテンシャルが内部と異なっているとき、表面に のみ局在するような、所謂表面準位が存在し得ることをはじめて証明した。また、Shockley⁶⁾(1939年)は、二つのバンドの縮退が摂動によってとけて、gap ができる場合 表面準位ができる可能性があり、そのエネルギーの値は gap 内にあることを導いた。

戦後, しばらくは Coul son⁷, Kou tecky⁸, Grimley⁹等により, 主に半導体を対象

-C99-

とした表面準位の研究が多くなされてきた。最近,実験の進歩とともに再び多くの論文 が見られるようになった。特に,遷移金属の表面準位が,紫外線による photo-electron spectroscopy (PES) で見られるようになり,多くの理論もでている。

(1) Zone boundary での表面準位¹⁰

$$\begin{vmatrix} E - E_1(k) & V(h) \\ V^*(h) & E - E_2(k+h) \end{vmatrix} = 0$$
(5)

kを実数にとれば、普通のバンドの準位が求まるが、表面準位では、kは複素数となる。kを実と虚の部分、k+i κ とおくと、surface state の波動関数 $\phi_{ss}(z)$ は、

$$\psi_{ss}(z) = Ae^{z} \cos\left(\frac{|h|z}{2} + \delta(E)\right)$$
(6)

$$\kappa^{2} = -E - \left(\frac{\pi}{a}\right)^{2} + \left[4E\left(\frac{\pi}{a}\right)^{2} + |V(h)|^{2}\right]^{\frac{1}{2}}$$
(7)

$$\sin 2\delta(\mathbf{E}) = \frac{\kappa |\mathbf{h}|}{V(\mathbf{h})}$$
(8)

と与えられる。Aは規格化定数である。Z>0を真空領域とすると,

$$\phi = \exp\left[-(V_0 - E)^{\frac{1}{2}} z\right] \quad (z > 0)$$
(9)

と与えられる。 z = 0で、 $\frac{d}{dz}(\ln \phi)$ が連続とおくと

$$\tan \delta(\mathbf{E}) = \frac{2}{|\mathbf{h}|} \left[\kappa + (V_0 - \mathbf{E})^2 \right]$$
 (10)

となる。これより、表面準位のエネルギー E_s , 波動関数 $\phi_{ss}(z)$ 等が求まる。

- C100 -

(2) 遷移金属の表面準位¹⁰⁾

次に、 s - バンド、d - バンドとの混成からできる表面準位を考える。 $E^{(s)}(k)$, $E^{(d)}(k)$ を s と d の無摂動のエネルギーとし、 $k = k_c$ で二つのバンドが縮退すると すると、摂動により二つのバンドは split し、

$$\mathbf{E} = \frac{1}{2} \left\{ (\mathbf{E}_{s} + \mathbf{E}_{d}) \pm \left[(\mathbf{E}_{s} - \mathbf{E}_{d})^{2} 4 | \mathbf{\Delta}_{k} |^{2} \right]^{\frac{1}{2}} \right\}$$
(11)

となる。(図3参照)k。近傍では,



図3 エネルギー準位の split

は(5)と同様に,

$$\varphi_{ss}(z) = A_{d} e^{\kappa z} \cos(k_{c} z + \delta(E))$$

$$\kappa^{2} = \frac{1}{m^{2}} (|A_{\kappa}|^{2} - E^{2} - m^{2} k_{c}^{2} + 2mk_{c} E)$$
(15)
(16)

$$\sin 2\delta(\mathbf{E}) = \frac{\pi_{\mathrm{III}}}{\Delta_{\mathrm{k}}}$$

となって,前式(6)で $\frac{2}{h}$ を $\frac{1}{k_c}$ におきかえれば全く同じになる。

$$E_{s} = \epsilon_{s} + ak \qquad E_{d} = \epsilon_{d} - bk \qquad (12)$$

$$a = \left(\frac{dE^{(s)}}{dk}\right)_{k=k_{c}}$$

$$b = -\left(\frac{dE^{(d)}}{dk}\right)_{k=k_{c}} \qquad (13)$$

$$k_{c} = \frac{\varepsilon_{d} - \varepsilon_{s}}{a + b}$$
(14)

と与えられる。 $a = b = m \sigma$ 場合は、図 の E_{min} , E_{max} の波数の実数部分は同じ になるので、式が簡単になるが、一般性 はそこなわれない。前と同様に、複素数 の波数を考えると、表面準位の波動関数

(17)

-C101-

 A_k は、金属イオンの近傍の実際のポテンシャルと無摂動のポテンシャルの違いか、あるいは spin-orbit coupling による摂動等による。

§ 3. Photoemission electon spectroscopy(PES) による表面準位及び水素吸着の電子状態

電子分光には、電界放射電子分光(Field-electron spectroscopy, FES)¹¹⁾ Ion neutralization spectroscopy(INS)¹²⁾,光電子分光(Photo-electron spectroscopy, PES)¹³⁾ 等あるが、ここでは、PES による表題の研究結果を述べ



図4 W(100) 面の光電子スペクトル

よう。

(1) W(100) 面の電子スペクトル

hωが 7~21eV の紫外線を単結晶 の表面にあて,表面に垂直方向に放出 される電子のエネルギー・スペクトル をとると,直接バルク内のバンド間の 遷移により放出されたものと,表面準 位にある電子が放出されたものと,明 瞭に区別できるので,その点すぐれた ものである。

図4は, Feuerbacher と Fitton¹³⁾ によるものであり, W(100) 面から 垂直に放出された電子のエネルギー・ スペクトルである。光のエネルギーは

7.7~11.7eV までで、図の右側の縦軸で示す。それぞれの光のエネルギーを基線 にして光電子のエネルギーのスペクトルを示す。縦軸の左側に光電子のエネルギー の分布密度を、横軸はフェルミ・エネルギーを基準にしたエネルギー値を示す。こ れは測定された光電子のエネルギー値に仕事関数を加え、照射した光のエネルギー を差引いたもので、光電子がはじめにあったレベルのエネルギー値を示す。

図4の①で示した-0.4 eVの peak は光のエネルギー値に無関係で、FES によっても既に観測されている。¹⁴⁾ これは、次に述べるようにW(100)面の表面準位 にある電子によるものと考えられ、Forstmann¹⁵⁾ 等により理論的に予言されていたものである。



図5は、Christensen¹⁶の求 めたWのバンド構造で、エネルギ ー値はフェルミー準位を零にとっ ていて、E_vで示した破線は仕事 関数を加えたものである。-0.4eVの peak はk~(0, 0.25, 0))付近で二つの Δ バンドの split した間にできた表面準位であると 考えてよいことを示している。

光が 9.5 eV以上のエネルギーの ものには,図4で②③で示す二つ のピークが現われる。③は,①の ピークと異なり,光のエネルギー によりそのエネルギー値は変化し ていて,表面準位によるものでは ない。図5の矢印で示す inter-

band transition によるものであることは間違いないと思われる。②の peakに対応 する interband transition は図 5に見られるように不可能である。③の矢印で示し たようにdN/dE の大きな-5eV 付近にある電子が直接金属外に放射されたものか、あ るいは-5eV付近の表面状態に由来するものであろう。但し、このような表面状態が可 態かどうかは理論的には、まだ計算されていない。(110)、(111)面については文 献13)を参照されたい。

(2) 水素の吸着による電子スペクトルの変化¹⁷⁾¹⁸⁾

図 6に、Wの (100) 面に水素を少しづつ吸着させていったときの光電子スペクト ルを示す。光のエネルギーは 10.2eV である。一番下の太い実線は水素を吸着させる 前のもので、図 4 の 10.2eV のときのと同じで、-0.4、-4.5、-5.2eV のところに それぞれピークがある。縦軸の右側に水素を吸着させたときの exposure (圧力×時 間)を示している。各々の exposure から、水素のWの (100) 面への sticking probabilty sとして、 $s = s_0(1-\theta)$, $s_0 = 0.2$ として、飽和吸着のときには、1.5 × 10¹⁵ a toms/cm² として、吸着率 θ を算出したものが、右側のそれぞれの基線の ところに示してある。各被覆率 θ のときの光電子のエネルギー・スペクトルからW (

-C103-



図 6. W(100) 面の水素吸着による光電子スペクトル(10.2 eV)

100)の吸着のないときのもの(図の下の実線で示してある)を差引いたものが示されている。

特徴のひとつは、-0.4 eV のピークは、吸着とともに急激に減少し、大略 $\theta = 0.2$ ~0.3 のところで消える。これらの吸着率で、水素の LEED(low energy electron diffraction)のパターンはC(2×2)構造を示す。また-4.5 eVの peak も interband excitationの-5.2 eV にある peak も次第に小さくなり、 $\theta = 1$ で殆 ど消える。

吸着のごく初期($\theta = 0.007$)では、-1.1、-5.4 eV(図6の①と②) にピーク が現われるが、 $\theta = 0.2 \sim 0.3$ で消える。一方、 $\theta = 0.015$ から-3.0 eV付近にブロ ードなピークが現われ、吸着が進むにつれて、幅は狭く中心はやや大きくなる。 $\theta =$ 0.5 より大きいときには、ピーク位置は-2.5 eVに、幅は0.5 eV(図6の③) にな る。

図7は、 $\hbar \omega = 21.2 \text{eV}$ によるW(100)面の水素吸着が $\theta = 0 \ge \theta \approx 1$ のときのスペクトル及び両者の差を示したものである。また図8は、同著者らによるW(100)面に水素等を吸着させたときの仕事関数の変化を示す。 $\theta < 0.1$ では仕事関数の変化は



図7 W(100)面の水素吸着による光電子スペ クトル(21.2 eV)



図8 種々のガスの吸着によるW(100)面の仕 事関数の変化

殆どなく,スペクトルは -1.1 eV と -5.4 eV に分れており, $\theta > 0.1$ でほぼ liner に 仕事関数は大きくなり,スペクトルは $-3.0 \sim -2.5 \text{ eV}$ である。

尚,図9及び10に、W(110)及びW(111)に水素が吸着したときの電子エネル

ギーのスペクトルを示しておこう。



図9 W(110)面の水素吸着による光電子 スペクトル



図11 W(111) 面の水素吸着による光電子 スペクトル

同著者らによる、CO、 O_2 、 N_2 の吸着によるスペクトルについては文献のみをあげておく。¹⁸⁾

最後に、表面準位の励起や in terband transition による光電 子のスペクトルが吸着によって, 何故消失するかについて、簡単に 説明しておこう。まず、表面状態 は、境界条件に敏感で、特に、エ ネルギーが高いほど敏感であるた めと考えられている。-0.4eVの 表面準位は水素吸着が θ = 0.2~ 0.3 位で,完全に消失する。表面 準位の消失が,表面準位にある電 子が水素と pairbond をつくるた めとすると, 表面状態の-0.4eV のピークの消失とともに、全く異 なる吸着状態が見られてよいわけ であるが, そのようなことは見ら れない。

光電子スペクトルの peak で interband transition によるも のが吸着により消えるのは,吸着 原子による散乱のためであろう。 伝導電子に対する吸着原子の散乱 の断面積は $3\pi r_s^2$ の大きさである が,フェルミ面により数 eV 高い エネルギーをもつ電子に対しても 恐らく~ πr_s^2 の大きさをもつであ ろう。それ故, $\theta \approx 1$ では, 垂直 の方向にでる電子はすべて散乱されて、ピークも消失する。

§ 4. 吸着理論

吸着の理論は、本質的に多体問題としてのアプローチが必要であることは、この節で 述べることから理解して頂けると思う。このような観点から吸着を論じたものは、筆者 の CI (Configuration Interaction)によるもの、Newns らの Anderson modelに よるもの、Schrieffer らの電子間のスピン、特に反強磁性的交換相互作用を強調した もの等ある。

以下, Newns, 筆者及び Schrieffer の理論および最近のものを簡単に紹介し,現在の理論でどの程度電子スペクトルが説明されるか述べる。

(1) Anderson model による吸着理論¹⁹

鉄、コバルトなどのイオンが nonmagnetic な金属に溶けると、局在化した magnetic moment をもつことはよく知られたことである。どのような条件で局在化した magnetic moment が存在し得るかを Anderson は 20 その essential と思われるも のを抽出した model Hamiltonian から出発した。 d - 準位を簡単のため一つだけと 考え、上向きスピンの電子(1)が金属のフェルミ面 $E_{\rm F}$ より低いEなるレベルにあって



図 11. Anderson modelの模式図

局在しているとする。magnetic momentが局在するためには下向 きスピンの電子(\downarrow)が近づいたとき, 電子(\uparrow)からuだけの反発を感じE + $u > E_p$ でなければならないで あろう(図11)。このような, スピンが逆向きのd -電子には, uなる反発があることが重要にな る。d -電子はs -電子との間に 相互作用があって, s -電子とd -電子は,相互にmixing してい る。このため局在化している実際 の状態では,平均 $\langle n_+ \rangle$ の上向き スピンの電子と,平均 $\langle n_- \rangle$ の下 向きのスピンの電子がある状態と して記述される。 d ー電子のエネルギーは、図11に示したように、各々の準位は逆 スピンの電子からの反発をうけて E+ u <n_> と E+ u <n_>になる。また、s - d mixing のため、これらの準位は幅をもつことになるであろう。 $\langle n_+ \rangle$ が $\langle n_- \rangle$ と 等しくないときが局在化した magnetic の状態で、 $\langle n_+ \rangle = \langle n_- \rangle$ であれば、 nonmagnetic の状態である。 $\langle n_+ \rangle$, $\langle n_- \rangle$ を求める出発点の model Hamiltonian として、上述の事情のみを抽出したのが、後出の(18)式である。

話を吸着に戻して,金属に水素が吸着したときを考える。水素と金属との間に電子の授受があると考える。 $I_H = 13.6 \text{eV}(4 \pi \nu k \pi \tau \nu \nu) A_H = 0.7 \text{eV}(電子親和力),金属の仕事関数を 4.5 \text{eV}とすると、金属から一個電子をとり出してH⁻をつくるのには 3.8 \text{eV},またH⁺をつくるのには 9.1 \text{eV必要である。吸着水素の準位はE_Fより 9.1 eV低いところから、3.8 eV高い所までの間にあり、一電子近似のエネルギーの場合とは異なるであろう。この観点から Newns は多電子問題を取扱うのにAnder son の model Hamiltonian$

$$H_{A} = \sum_{k,\sigma} \varepsilon_{k} n_{k\sigma} + \sum_{\sigma} \varepsilon_{s}^{0} n_{s\sigma} + \sum_{k,\sigma} (V_{ks} C_{k\sigma}^{\dagger} C_{s\sigma} + V_{ks}^{\dagger} C_{s\sigma}^{\dagger} C_{k\sigma})$$
$$+ U < n_{s\uparrow} > < n_{s\downarrow} >$$
(18)

を用いた。 $C_{k\sigma}^{+}$, $C_{k\sigma}$, $C_{s\sigma}^{+}$, $C_{s\sigma}$ は金属のk - 電子, あるいは吸着原子のs - 電子 のスピンσをもったもののcreation, destruction operatorで, $n_{k\sigma} = C_{k\sigma}^{+} C_{k\sigma}$, $n_{s\sigma} = C_{s\sigma}^{+} C_{s\sigma}$ はoccupation number operator, ϵ_{k} はk- 電子, ϵ_{s} は吸着原子 のs - 電子のエネルギーである。 V_{ks} , V_{ks}^{*} は mixing の行列要素で, Uとしては(13.6-0.7) eVをとった。 ϵ_{k} , ϵ_{s}^{0} は無摂動のk-, s- 準位のエネルギー

 $\epsilon_{s\sigma} = \epsilon_{s}^{0} + U < n_{s, -\sigma} >$ ⁽¹⁹⁾

である。<n_{s, σ}>, <n_{s, $-\sigma$}>が self - consistent になるように解くことが問題になる。また

$$V_{ks} = \int \varphi_k^* V \varphi_s \, \mathrm{d}\,\tau \tag{20}$$

である。

 H_A の固有関数 $\varphi_{n\sigma}$ は、 φ_k 等と φ_s との一次結合で与えられる。 $< n_{s\sigma} > o$ self - consistent な条件は

$$\sum_{\mathbf{n}} | (\varphi_{\mathbf{n}\sigma}, \varphi_{\mathbf{s}\sigma}) |^{2} = <\mathbf{n}_{\mathbf{s}\sigma} >$$
(21)

である。吸着原子の s 一準位のエネルギー $\epsilon_{s\sigma}$ は逆スピンが準位を占める数によって かわり,幅をもっているが, $\epsilon_{s\sigma} \sim \epsilon_{s\sigma} + \Delta \epsilon$ の間にある local density of states を $\rho_{s\sigma}(\epsilon) \Delta \epsilon$ とすると,

$$\rho_{s\sigma}(\varepsilon) = \Sigma | (\varphi_{n\sigma}, \varphi_{s\sigma}) |^2 \delta(\varepsilon - \varepsilon_{n\sigma})$$

で与えられ,(21)式は

$$\int_{-\infty}^{E_{\mathbf{F}}} \rho_{s\sigma}(\epsilon) d\epsilon = < n_{s\sigma} >$$
(22)

となる,

 $\rho_{s\sigma}(\epsilon)$ は、

n_{s,-\sigma}>を含んだ形で、グリーン関数の方法で容易に求められ、

$$\rho_{s\sigma}(\epsilon) = \frac{1}{\pi} - \frac{\Gamma(\epsilon)}{\left[\epsilon - \epsilon_{s\sigma} - \Lambda(\epsilon)\right]^2 + \Gamma^2(\epsilon)}$$
(23)

となる。準位の幅を与える $\Gamma(\epsilon)$ は、

$$\Gamma(\epsilon) = \pi \Sigma |V_{ks}|^2 \delta(\epsilon - \epsilon_k)$$

$$= \pi |V_{ks}|^2_{AV} N(\epsilon)$$
(24)

である。 $N(\epsilon)$ は,固体のk-電子の level density である。また,準位のズレをあらわす $\Lambda(\epsilon)$ は,

$$\Lambda(\epsilon) = \frac{P}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\Gamma(\epsilon')}{\epsilon - \epsilon'} d\epsilon'$$
(25)

となる。Pは主値をとることを意味する。(19)と(23)式から $\rho_{s\sigma}$ と<n $_{s\sigma}$ > を求めることができる。常に nonmagnetic な解<n $_{s\uparrow}$ >=<n $_{s\downarrow}$ > は存在するが、UがU_c>

$$\frac{1}{\rho_{s\sigma}(E_{\rm F})}$$
のときは, magnetic な solution が存在する。
 $\rho_{s\sigma}(\epsilon)$ がどのように与えられるかを、 $V_{\rm ks}$ が十分小さいときと、逆に十分に大きいときで見積ってみよう。吸着にあずかるバンドは一つだけとして、その幅は ζ_0 、中

心のエネルギーは ϵ_{c} とする。 V_{ks} が十分小さいと $\Gamma(\epsilon)$ も $\Lambda(\epsilon)$ も ς_{0} に比較して小さ く $\rho_{s\sigma}$ は $\epsilon_{s\sigma}$ の近くに狭いピークをつくる。もし、 $\epsilon_{s\sigma}$ がバンドの外にあれば、 $\Gamma(\epsilon_{s\sigma}) = 0$ となり、 $\rho_{s\sigma}$ は、 $\epsilon_{s\sigma}$ からすこしずれた所で δ – 関数型のものになる。 $\epsilon_{s\sigma}$ がバンド内にあれば、 $\rho_{s\sigma}$ は半値幅が $\Gamma(\epsilon_{s\sigma})$ で、中心が $\epsilon_{s\sigma} + \Lambda(\epsilon_{s\sigma})$ のLorentzian function になる。 $\rho_{s\sigma}$ の幅 2 Γ は不確定原理から得られるものと一致し、

$$2\Gamma = \frac{\hbar}{\tau} = 2\pi |V_{ks}|^2_{AV} N(\epsilon_{s\sigma})$$
(26)

である。

吸着のエネルギー 4Eは,

$$\Delta E = \sum_{\sigma} \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{E} F \tan^{-1} \left[\frac{\Gamma(\varepsilon)}{\varepsilon - \varepsilon_{s\sigma} - \Lambda(\varepsilon)} \right] d\varepsilon - \varepsilon_{s\sigma} < n_{s\sigma} >$$
(27)

ただし、 $-\pi < \tan ["] < 0$ である。Newns は一次元結晶の準位密度

$$N(\varepsilon) = \frac{N(0)}{\varepsilon_{0}} \quad \sqrt{\varepsilon_{0} - \varepsilon} \qquad |\varepsilon| < \varepsilon_{0}$$

$$= 0 \qquad |\varepsilon| > \varepsilon_{0}$$
(28)

をとり、 $\Delta E \varepsilon \beta' = \sum_{k} |V_{ks}|^2$ の関数として求めている。 E_F や仕事関数には、Ti Cr, Ni, Cu の値をとり、 U= 12.9eVとして、 ΔE から β' の値を逆算すると、 3.7 ~4.2eVを得た。いずれの場合も nonmagnetic な解< $n_{s\uparrow} >= < n_{s\downarrow} >$ である。 β' がバンドの幅2 ϵ_0 を越えると、表面原子と吸着原子の分子ができてしまう。吸着原子の 電子数は 0.2 ~ 0.3 個増える。観測されている仕事関数の増加は 0.3 ~ 0.5eV である ので、表面と吸着原子の間の距離は 0.1Åで、非常に小さくなる。

電子エネルギーのスペクトルは(19)式

$$\epsilon_{s\sigma} = \epsilon_s^0 + U(n_{s,-\sigma})$$

で, $< n_{s\uparrow} >= < n_{s\downarrow} > \approx 0.5 \sim 0.6$ であるから

$$\epsilon_{a\sigma} \approx 2.5 \,\mathrm{eV}$$

で,幅は

$$\Gamma \approx \frac{\pi (\sqrt{N} V_{ks})^{2}}{\zeta_{0}} \quad (\zeta_{0} はバンド幅)$$

となり,あまりよい一致とはいえない。

 V_{ks} が十分に大きく $\Gamma(\epsilon)$ がバンドの幅 ς_0 よりも、 $|\epsilon_{s\sigma}-\epsilon_c|$ よりも大きくなるときは、 $\Lambda(\epsilon)$ は非常に大きくなり、 ϵ がバンドの上では Λ は正に、また、バンドの底より低いところでは Λ は負になる。 $\rho_{s\sigma}$ は二つの鋭いピークをもちーつのピークはバンドより上に、他はバンドの下にある。このことは、前節に述べた電子スペクトルで、 θ が小さいとき、-1.1 eVと-5.4 eVに二つのピークが見られることに対応しそうである。しかし、このときは水素はH⁻となるわけであるのに、仕事関数の増加は図8で見たように、水素は中性になっているので、これでは説明できない。さらにUが大きい場合に、U<n_{s1}><xる近似を用いることは悪い近似であろう。(2) CI(Configuration Interaction)による吸着理論^{21),22}

CI による解はきまった手続によって、次の如くなされる。出発点になる Hamiltonian は吸着原子として水素原子を例にとり、固体としては金属を考えると、

$$H = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N+1} \Delta_{i} + \frac{1}{2} \sum_{i,j \ (i \neq j)} \frac{1}{|r_{i} - r_{j}|} + \sum_{i,j} u (r_{i} - R_{i})$$

$$-\sum_{i} \frac{1}{|r_{i}-R_{H}|} + \frac{1}{2} \sum_{\ell,\ell'(1\neq j)} \frac{1}{|R_{\ell}-R_{\ell'}|} + \frac{1}{2} \sum_{\ell} \frac{z}{R_{\ell}-R_{H}}$$
(29)

である。 r_i , i = 1.2 N, N+1 はN個の金属の価電子と水素の電子の座標で, R_1 , R_1 , R_1 , k = 1.2 N, N+1 はN個の金属の価電子と水素の電子の座標で, R_1 , R_1 , k = 1.2 N, R_1 , R_2 , R_1

 $\varphi(k, r)$ を金属と電子が十分離れているときの(29)式から得られるk 一電子に対する Hartree-Fock の方程式を満す波動関数, $\varphi(s, r)$ は水素の 1s の波動関数と すると、全系の波動関数 Ψ_a は N+1 個の波動関数の Slater derterminant

$$\Psi_{\alpha} = |\alpha\rangle = \frac{1}{\sqrt{(N+1)!}} \det |\varphi(k_{i}, r_{j})|$$
$$= |k_{i}, \dots, k_{N}, s\rangle$$
(30)

で与えられる。

水素が金属表面に近づいてくると、水素と金属の波動関数の重り合いがおこり、Pollard が示したように、

$$< k_1, \dots, k_N, s |H| k_1, \dots, k_N, s >$$
 (31)

には、金属と水素原子との間に交換反発がおこり、図12で MHの曲線で示したよう



図12 金属表面近傍での水素のポテンシャル

に 1 s 準位のエネルギーは高くなる。同時に水素と金属との間に電子のやりとりが始まり、 1 s 電子が金属のフェルミ面より高く、空いている k_{α} – 準位をしめて $(k_1, \dots, k_H, k_{\alpha})$ なる configuration になったり、逆に水素電子とは逆平行のスピンをもつ k_i – 電子が水素の 1 s 軌道を占めて $(k_1, \dots, s \downarrow, \dots, k_N, s \uparrow)$ という configurationをつくるであろう。図 1 2 で、M⁻H⁺ あるいはM⁺H⁻ で示した曲線は、それぞれの一番エネルギーの低い configuration のエネルギー曲線を画いたものである。M⁻H⁺ は image force のため表面に近くなると、そのエネルギーは下ってくる。 image force をつくるためには、金属電子がうける摂動に対応した

configuration も入ってくるが、 explicit には問題にしない。 M^+H^- は金属の交換 反発がMHの2倍になる。(実際には、 H^- の1s 軌道は拡がり、反発は2倍以上に なる。また、 image force は電子が水素と金属との間をゆききしているときには、 静的な image force の半分くらいである²³)

Configuration interaction で重要なものは,

$$V_{\alpha s} = \langle k_1, ..., k_N, k_{\alpha} | H | k_1, ..., k_N, s \rangle$$
 (32)

Þ

$$V_{si} = \langle k_1, \cdots, s \downarrow, \cdots, k_N, s \uparrow | H | k_1, \cdots, k_i \uparrow, \cdots, k_N, s \uparrow \rangle$$
(33)

であって、いずれもほぼ等しく、その大きさには伝導電子間の exchange が主な寄与 をして、 $\sqrt{N} |V_{\alpha_s}| \approx \sqrt{N} |V_{si}|$ は数 eV になる。

Configuration の間における coupling には他にもあるが,その大きさは、 V_{as} や V_{si} のほぼ5分の1位の小ささである。例えば、(k_1 , …, $k_i \downarrow$, …, k_N , $s\uparrow$)と(k_i , …, $s_i \downarrow$, … k_N , $k_a\uparrow$)の如く $k_i \downarrow$ が $k_a\uparrow$ とスピン反転するような場合等である。しかし、後に述べる Schrieffer らの理論では、吸着に最も重要な項として取扱われている。

基底状態 $|\alpha\rangle$ と couple する $|\beta\rangle$ 等の一次結合として(29)式の固有値を求める永 年方程式は、

$$\det \cdot | < \alpha |H| \beta > -E < \alpha |\beta > | = 0$$
(34)

で得られるが,第二近似の摂動で解くことは容易である。結果は,銅の上の水素の吸着で,d電子の影響を無視して,安定な位置から~1Å, ⊿E~3eV である。また水素のもつ電子数は 1.015で,仕事関数の増加は観測値の半分位の理論値を得る。

なお、図12で表面近傍に、安定な吸着点が存在することが推論される。水素が電 子を金属に与えプロトンとして表面近くにある場合で、アルカリ金属の吸着、あるい は poor absorber への水素の吸着と似たものと考えられる。

(3) Schrieffer の吸着理論²⁴⁾

吸着理論にはほとんどMO法(molecular orbital)が使われてきた。Bennettらの示したように、CNDO(complete neglect of differential orbital)でクー ロンエネルギーを近似的に考慮すれば、軌道についてのパラメーターを適当にとるこ とによって比較的よい結果を得ることができた。この理由として考えられるのは,bonding と antibonding の状態のエネルギー差が大きく, antibonding の状態を考え ないでよかったからであろう。しかし, 両者の間のエネルギー差が小さく, 両者の mixing を考えなければならない場合は簡単でなくなる。平行, あるいは反平行の電 子間の相関が重要なわけで, 高い近似で相関を取扱わなければならないからである。

Bonding と antibonding の状態の分離は,準位の splitting の幅 Г が目安になる。 Γ が Uに比較的近い場合は,分離が大きく,MO法は有効になるであろう。

最近の、金属にガス等を吸着させたときの、電子のエネルギー・スペクトルでは、 Γ が1eV 程度のものが多い。このように、U》 Γ の場合には、Hartree-Fockで平 行スピンをもつ電子間の平均の相関を考慮する近似よりは、Heitler - London (H-L)的な取扱いによって、反平行スピンをもつ電子間の相互を正しく考慮するのがよ い近似であろう。水素分子の場合には、スピンが反平行な二つの電子があって、強い 相関で、一つの原子には、一つの電子が占め、exchange しているというH-Lの扱 い方は、MO法に較べ近似がよい。MO法では、一番エネルギーが低い分子軌道に二 つの電子がお互いに無関係に動き回っているということで、Hartree-Fock 的な形 で相関が考慮されているだけである。

Schrieffer らは、以上のような考えからH-Lに従って吸着を考えた。金属電子 の軌道と、吸着原子の軌道が重り合うところでは、反強磁性的交換相互作用をする。 即ち、二つの電子のスピンが反平行のときが attractive になる。吸着原子のすぐ近 くでは、吸着原子の電子スピンとは反平行なスピンをもつ電子が局在し、これらの電 子が^{**} induced covalent bond ″をつくるというのである。このような考え方は、 遷移金属原子を含む稀薄合金の Kondo 効果からも裏付けされる。

吸着原子の近くに反平行のスピンが誘起されるときの事情をもう少し精しくあたって見よう。吸着原子Aのすぐ隣りにある金属原子Mを考える。Mに大きさS(0~ $\frac{1}{2}$)なるスピンが誘起されるエネルギーは $\frac{(\mu_BS)^p}{2}X_{1oc}$ で与えられる。 μ_B はBohr マグネトンで、 X_{1oc} はローカルな磁気感受率である。この正しいことは、これに磁場Hがあるときのゼーマン・エネルギー - μ_B SHを加えたエネルギーの最小の条件として μ_B S= X_{1oc} Hが得られるが、この式は丁度、 X_{1oc} の定義の式になっているからである。Sが $\frac{1}{2}$ の最大の値をもつときは、AとMの間に対結合ができてA-Mなる分子ができる。その解離エネルギーをW_mとする。また、Sの最小のS=0のときは、

-C114-

AとMとの間には、 W_r なる反発が働くであろう。S=0, $\frac{1}{2}$ のときのA-Mのエネ ルギーを一次的に内捜すると、 $-2(W_m + W_r)S + W_r$ になる。これに反平行のスピ ンを誘起するエネルギーを加えて、

$$\Delta E(S) \approx \frac{(\mu_B S)^2}{2X_{loc}} - 2(W_m + W_r) S + W_r$$
(35)

この最小のエネルギーは、 Sが

$$\mu_{\rm B} \, {\rm S} = \frac{2 \, X_{\rm loc} \, ({\rm W_m} + {\rm W_r})}{\mu_{\rm B}} \tag{36}$$

のときで

$$\Delta E = -\frac{2X_{\text{loc}}}{\mu_{B}^{2}} (W_{m} + W_{r})^{2} + W_{r}$$
(37)

である。バンドは半分つまっていて,その幅く₀とすれば, $\frac{2X_{loc}}{\mu_B^2} \simeq \frac{1}{2} \zeta_0$ である。 (37)式は,

$$\Delta E \simeq \frac{\left(W_{\rm m} + W_{\rm r}\right)^2}{2\zeta_0} + W_{\rm r}$$
(38)

と、金属のバンドを関連させることもできる。

以上のような考えを定式化するにはどうしたらよいかを簡単に述べよう。金属の波動関数 $\varphi(\mathbf{k}, \mathbf{r})$ と吸着原子の $\varphi(\mathbf{s}, \mathbf{r})$ が直交していないということ、即ち、 $S_{\mathbf{ks}} = \langle \varphi(\mathbf{s}, \mathbf{r}) | \varphi(\mathbf{k}, \mathbf{r}) \rangle$ が一般に0 でないことも考慮にいれる。また、

$$| \alpha \rangle = | \mathbf{k}_1, \dots, \mathbf{k}_i \uparrow, \dots, \mathbf{k}_N, s \downarrow \rangle$$
 (39)

に対し

$$|\beta\rangle = |\mathbf{k}_1, \cdots, \mathbf{s}\uparrow, \cdots, \mathbf{k}_N, \mathbf{k}_{\alpha}\downarrow\rangle$$
 (40)

のように、 s $\downarrow \rightarrow k_{\alpha} \downarrow$ になると同時に、 $k_i^{\uparrow} \rightarrow s^{\uparrow}$ になるような configuration と の coupling が重要である。 $| \alpha > \varepsilon | \beta > \varepsilon$ の直接の coupling は、既に述べたよう に小さく、 Schrieffer らは、 $| \alpha > \rightarrow | k_1$ 、 … s \uparrow 、 …, k_N 、 s $\downarrow > \rightarrow | \beta > \varepsilon$

-C115-

$$< \alpha \mid \beta > = \delta_{\alpha\beta} + D_{\alpha\beta}$$

$$\mathbf{D}_{\alpha\beta} = -\left(-1\right)^{\nu_{\alpha\beta}} \mathbf{S}_{\mathbf{k}_{\alpha}\mathbf{s}} \mathbf{S}_{\mathbf{k}_{i}\mathbf{s}}$$

となる。 $\nu_{\alpha\beta}$ は、 $k_i > k_\alpha$ との間にある占められている軌道の数である。固有値は、 (34)式を解くのと同様に求められる精細は文献24)を参照されたい。

(4) 吸着の電子スペクトル理論

W(100) 面上の水素吸着の電子スペクトル(図6)は、文献17) に述べられてい るように、 $\theta = 0.007 \sim 0.14$ では Fermi 準位を基準にして、-1.1 eV と-5.4 eV と に吸着の peak ができ、 $\theta = 0.015$ 位から $\sim 3 \text{eV}$ 付近にはじめは二つの peak の重 なったようなスペクトルがあらわれ、はじめに見えた-1.1 eV と-5.4 eV は次第にな くなる。更に吸着が進むと、-2.5 eVを中心にした一つの peak になる。その半値幅 は 0.5 eV である。

図8に示すように θ = 0.1 までは仕事関数は変化しないで初期にあらわれる二つの peak は水素が金属表面上の step とか kink その他の格子欠陥に吸着したものと思わ れる。それが吸着率が高くなると消えるのは何故かはわからない。 – 3eV 付近で θ = 0.015 ~ 0.31 のときの複雑な構造は,吸着原子間の interaction によるものであろ う。

Newns の理論によれば、 V_{ks} が十分に大きく $\Gamma(\varepsilon)$ がバンドの幅や $|\varepsilon_{s\sigma} - \varepsilon_c|$ よりも大きいときには、バンドの上と下に二つの鋭い peak をもつことになるが、これに初期の二つの peak にあたるとすると吸着水素はH となり仕事関数を増加させなければならないが実際には仕事関数は変らない。 Newns の理論でも、CI理論あるいは Schrieffer の理論でも、この初期のピークはついては説明できない。しかし、 θ が適当に大きいところでは、 ~ -3.0 eV付近に peak ができることは、Newns の理論から一応理解できることはすでに述べた通りである。即ち、(19式から

 $\varepsilon_{s\sigma} = \varepsilon_{s}^{0} + U < n_{s,-\sigma} >$

で、U=12.9eV, $< n_{s,-\sigma} > \approx 0.55 \sim 0.6$ であるから $\epsilon_{s\sigma}$ は Fermi 面から測ってほ ぼ-3eV 程度 である。しかし、 $\Gamma(\epsilon_{s\sigma})$ は数 eV以上になり、観測されるような鋭い peak は説明できない。

CI理論からは、各 configurationのmixingの割合はきめられ、それから水素の準

位がでてくる。その大きさは妥当なものであるが、幅はNewnsの理論と全く同じで その値は大きすぎる。Schriefferの理論では、電子スペクトルを説明することは非 常に難しい。

Lyo と Gomer²⁵⁾は、Kanamori-Terakura-Yamadaのpseudo-green 関数 を用い、吸着点近傍における金属の電子の準位密度に Penn²⁷⁾が求めたものを用いた。 水素原子内の電子間のクーロン相互作用Uは、前述のように(I-A)とする代りに、 水素原子が中性のときには、1S電子はプロトンの鏡像から+ $\frac{e^2}{2d}$ (dは水素原子と 金属表面との距離)なる反発と、自分自身の鏡像ポテンシャル - $\frac{e^2}{4d}$ をうけることか ら、1S 準印は $\frac{e^2}{4d}$ だけ準位が上り、H⁻のときの追加された電子は鏡像によって、 - $\frac{e^2}{4d}$ 下ることから

$$U = I - A - \frac{e^2}{4d}$$

とした。 Lyo らの理論では、 peak は二つでているのであるが、問題点も多い。

最近, Kohn, Lang, Smith らは, 電子分布密度の関数方程式から出発して, 金 属の仕事関数とか吸着等を論じてきたが, LangとWilliams は exchange と correlation には, Kohn と Sham²⁹⁾の理論を使って, 金属に H, Li, O, Cl, Si が 吸着したときの電子スペクトルを求めた。実験との一致は比較的よい。最近, 訪日し た Schrieffer は, この方法に更に分布密度の relaxation をも explicit に考慮し, その展開を試みている。 relaxation が大切なのは, 例えば, 電子が金属と吸着原子 との間を hopping するとき image force potential はどの程度電子の速さに follow できるかということに関連するからである。

§ 5. 二つの吸着状態と吸着による電気抵抗変化

Ni, Fe, Cu, Pt などの所謂 poor-absorber に水素が吸収されるときは、水素はプロトンと電子とに解離し、電子は s-band、 d-band に入る。プロトンは s 電子 あるいは d 電子に遮蔽される。これらの水素は、 intersitial の平衡点を中心にゆるや かな振動をしていて、室温以上では、近似点に自由に金属内を動いていると考えられて いる。吸収熱は、吸熱で $10 \sim 30$ kcal/mol、 一原子当り $5 \sim 15$ kcal/mol である。

このような状態で金属中に吸収されている水素を表面にもってくるとどうなるであろうか。第一に,金属イオンと陽子の反発は,殆どは遮蔽されてはいるが,表面では小さ

戸谷富之

くなるであろう。しかし,全系の電子の運動エネルギー(K.E.)はThomas-Fermiの近似を使って,

K. E. =
$$\int \left(\rho_0 + \delta \rho \right)^{\frac{5}{3}} d\tau$$
 (41)

の大きさは

$$\int \left(\rho_0 + \delta\rho\right) d\tau = N + 1 \tag{42}$$

(Nは金属電子の数,N+1はそれに水素原子の電子が一個加わったもの)であり,K. E.のベキ数が $\frac{5}{3}$ で1より大きいから、 $\rho_0 + \delta \rho$ が平均的にできるだけ、平らであるほうが,小さいから、陽子が表面にあるほうが安定になる。実際には、Thomas-Fermi近似では、不充分で $\rho_0 + \delta \rho$ の勾配に依存するWeiszäckerの補正項が入り、表面では、Thomas-Fermi近似で求めたエネルギーの減少は少くなるが、全体のエネルギーの減少には変りないことが分る。

陽子をさらに外にもってくると、ポテンシャル曲線は、M⁻H⁺のものと一致する(図 12)。図で、s-type adsorption(S型吸着)と書いたものは、absorbed hydrogen と同じ mechanism で吸着されるものをさし、r-type adsorption(r型吸着) は、§4で論じたような金属と水素との電子の交換によるものである。通常の金属の仕 事関数の大きさに於ては、M⁺H⁻のエネルギーがM⁻H⁺より低いことより、r-型の 吸着原子は、負に分極し、この吸着により、仕事関数は増大する。また、hoppingのマ トリックスエレメントの値が大きいため伝導電子を容易にトラップして金属に再放出す る。換言すれば、伝導電子は、r-型吸着原子により、散乱され、その散乱断面積は、 $3 \sim 4\pi r_s^2$ である。一方、散乱断面積が $3 \sim 4\pi r_s^2$ と大きいことは、吸着原子同志の反 発が、伝導電子を介して、大きいことを意味する。結合にあづかる伝導電子をお互いに 奪いあうからである。

 $s - 型吸着原子による伝導電子の散乱断面積は <math>0.3 \pi r_s^2$ で,r - 型吸着電子に比べ, 10分の1の大きさである。陽子を遮蔽している電子分布は smoothing effect のため, 球対称からずれ,仕事関数をわずかであるが,減少させる。表面上でのマイグレーショ ンの活性化エネルギーは,吸収原子の拡散のそれより小さいであろう。陽子の NMR で は shift は Knight effect で大きいであろう。

(1) 薄膜の電気抵抗²⁾

金属の薄膜に水素が吸着すると、その電気抵抗は変化する。この抵抗変化から金属

(45)

表面と水素原子との結合に対する知見が得られる。Ni 等についての実験結果から, 水素吸着には一般に二種類あり,一つは pair-bond 的なもので,抵抗を増加させ, もう一つのものは溶解に類似したもので,抵抗を減少させることが知られている。

この節では、薄膜の電気抵抗に及ぼす水素吸着の影響の一般論を概説し、次に r – 型及び s – 型吸着による抵抗変化について述べる。

金属薄膜の比伝導度σは、薄膜の厚さd,伝導電子の単位体積当りの数N,塊状の 比伝導導度σ₀,そのときの平均自由路1, Fermi面における平均速度v,及び薄膜 表面で,電子の鏡面反射される確率pによって,次のように与えられる。

$$\sigma_{0} = \sigma \left\{ \varphi_{p} \left(\frac{d}{\ell} \right) / \left(\frac{d}{\ell} \right) \right\}$$
(43)

但し,

$$\frac{x}{\boldsymbol{\varrho}_{p}(x)} = 1 - \frac{3}{2x} (1-p) \int_{1}^{\infty} \left(\frac{1}{t^{3}} - \frac{1}{t^{5}}\right) \frac{1 - \exp(-xt)}{1 - \exp(-xt)} dt \qquad (44)$$

$$\sigma_0 = \frac{\operatorname{Ne}^2 \ell}{\mathrm{m} \, \mathbf{v}}$$



図 13 種々の d/ℓ の値の鏡面反射の確率 $p \ge \sigma_0/\sigma$ の理論値

戸谷富之

p=1,即ち,表面で電子が常に鏡面反射するときは、(43)と(44)より、 $\sigma = \sigma_0$ で、 比伝導度は薄膜でも塊状のものと同じである。図13の種々の値に対する $\frac{\sigma_0}{\sigma}$ とpと の関係を示す。膜の厚さが平均自由行路 ℓ に比べ十分小さいときは、pの大きさによ り $\frac{\sigma_0}{\sigma}$ は著しく変化する。

薄膜の抵抗 R_0 は、 σ 及びd に逆比例するから、比例定数を C' として

$$R_{0} = \frac{C'}{\sigma \cdot d} = \frac{C'}{d^{2}} \frac{m\bar{v}}{Ne^{2}} \left(\frac{d}{\ell}\right) \left\{ \varphi_{p}(d/\ell)/(d/\ell) \right\}$$
(46)

で与えられる。あるいは,

$$\mathbf{C} \cdot \mathbf{R}_{0} \quad (\mathbf{d}) \cdot \mathbf{d}^{2} = \boldsymbol{\varphi}_{n} \left(\, \mathbf{d}/\ell \, \right) \tag{47}$$

$$C = \frac{Ne^2}{C'm\overline{v}}$$
(48)

で与えられる定数である。

吸着が抵抗に影響するのは、(43)、(44)、(45)式からわかるようにNやpを変化させるからである。

(i) r型吸着による抵抗変化

水素がr型で吸着したときの,仕事関数の増加から推定される水素の荷電は0.02 e 程度であり,理論値も同じ程度である。この大きさは,仕事関数には効くが,電 気抵抗には殆ど問題にならない。鏡面反射の確率 p が零でないときに,r型の吸着 がおこると,伝導電子は,吸着原子によって trap されすぐに金属内に reemittされ るという過程によって,散乱されるので p の大きさは減少して,抵抗は大きくなる。 吸着水素による散乱の断面断 $\sigma(r)$ は, $\sqrt{N} V_{\alpha_s} \approx \sqrt{N} V_{si} \approx 3 \text{eV}$ をつかうと 3.0 ~ $4.0 \pi r_s^2$ で非常に大きい。²⁾²²⁾即ち,吸着原子から~ 2 r_sの距離のところにきた 伝導電子は散乱されるわけで, $\theta \sim \frac{1}{3}$ まで吸着されると鏡面反射の確率 p は零にな る。

抵抗増加(**ð**R)は、(47)式より、

$$\operatorname{c} \delta \operatorname{R} \cdot \operatorname{d}^2 = \boldsymbol{\varphi}_{\mathbf{r} = 0} \left(\operatorname{d}/\ell \right) - \boldsymbol{\varphi}_{\mathbf{r} = 0} \left(\operatorname{d}/\ell \right)$$

(49)

あるいは,

$$\frac{\delta R}{R} = \frac{\boldsymbol{\varphi}_{p=0}(d/\ell) - \boldsymbol{\varphi}_{p0}(d/\ell)}{\boldsymbol{\varphi}_{p0}(d/\ell)}$$

で与えられる。

(ji) s型吸着による抵抗変化

r型吸着のほうが一般に吸着熱が大きいので,初期は専らこの型の吸着のみおこ るが,r型吸着原子間の反発も大きく,その有効範囲は,散乱断面積と同じ程度で あるから,抵抗増加が極大に達する前後から,s型吸着がおこる。

s型吸着では、1吸着原子当り1個の伝導電子が増加する。吸着によって電子濃度NがN+ \deltaN に増加すると、(47)、(48)式からPは変らないとすると、

$$\frac{\delta_{\rm R}}{\rm R} = -\frac{\delta_{\rm N}}{\rm N} + \frac{\delta_{\rm v}}{\rm v} = -\frac{2\,\delta_{\rm N}}{3\rm N} \tag{51}$$

となる(\overline{v} は $N^{\overline{3}}$ に比例するから $\frac{\delta \overline{v}}{\overline{v}} = \frac{1}{3} \times \frac{\delta N}{N}$ である)。

s型吸差水素の伝導電子の散乱は,遮蔽されたプロトンによる電子の散乱で,散 乱断面 $\sigma(s)$ は, $0.3\pi r_s^2$ で鏡映反射の確率 pの減少させかたは, r型吸着に比べ十 分の一程度である。一方, 1吸着原子当り, 1伝導電子をふやすので,抵抗を減少 させる。

(2) 金属薄膜の吸着による電子抵抗の変化の実験例

実験例

超高真空技術の発展により、ガス吸着による金属薄膜の抵抗変化が、正確に測定されるようになったのは1958年以降のことである。

(1) ニッケル蒸着膜については水素吸着による抵抗変化の実験が、厚さが100Å~ 500Å,温度は90°Kと273°Kに於いて、精しい実験がSuhrmann et. al.³⁰ Muzushima³¹⁾等により行なわれている。図14は、その典型的な例である。 $\theta \approx \frac{1}{3}$ までは、rー型吸着が主におこり、抵抗は増加し、それからはsー型の吸着がおこるために抵抗は減少する。rー型の吸着は、吸着熱は大きく、はじめはこの種の吸着のみおこるが、吸着原子間の反発が最近接原子間で、2~3 kcal/moleと大きく(この反発は既にに述べたように、伝導電子を介しておこり、伝導電子の散乱に対する断面積が3~4 π r²_sであることも、この反発が大きいことと対応する)、水素の気圧が10³ Torr 以下では、これ以上の吸着はおきない。抵抗増加が鏡面反

(50)



図14 Ni 蒸着膜の水素吸着に対する抵抗の相対的増加 δ R/R

射の確率 Pの減少によるものであることは、図15に示すように、 δ Rの最大値は 90°Kでも273°K でも同じで、厚さdの自乗に逆比例することから結論される。 吸着前の pの値を 0.04 ととり、 $\theta = \frac{1}{3}$ で p = 0 であるとすると、50式から、図 16の如く理論値と実験との一致はよい。

 $\theta = 0.33 \sim 0.7$ では、s ー型吸着がおこり抵抗は減少する。一吸着原子当り、一 電子だけ伝導電子が増加したとする、(51)式のように

 $\frac{\delta \mathbf{R}}{\mathbf{R}} = -\frac{2}{3} \frac{\delta \mathbf{N}}{\mathbf{N}}$

の関係がよく成立している。



- (前) 白金については、固 体窒素の温度では、水 素の吸着に伴いニッケ ルの場合と同じような 抵抗変化を示すが、そ れより高い温度では, はじめの抵抗増加は次 第に小さくなり,200° K以上では,はじめか ら抵抗減少が見られる。 このことは, r-型, s -型吸着の吸着エネ ルギーの差は小さく~ 1kcal/mol で,s 一型 吸着がmigrationしや すいことは, 表面に平 行方向の振動がゆるや かで,温度が高くなる とs-型吸着の吸着熱 の方がエントロピー項 で得するためと考えら れる。精しくは文献2) を参照されたい。 (前) 鉄, タングステンの



図 17 Fe 蒸着膜の電気抵抗についての水素吸 着による変化



図 18 W蒸着膜の電気抵抗の水素吸着による。 変化

合より著しい。これは, r 一型 吸着の吸着エネルギーが s 一型 吸着のエネルギーより~ 3kcal /mole 程度しか大きくないため である(ニッケルの場合は~ 6 k cal/mole)。

タングステンでは、逆にこの 差が大きく~15kcal/moleで、 10^{-3} Torr 以下の真空度では s - 型吸着はおこらず、r - 型吸着による抵抗増加のみしか見 られない。図18で見 られる 77°Kでの僅かな抵抗減少は、 仕事関数の大きな減少を伴うの で、s - 型吸着によるものと考えるよりは $H_2^{(+)}$ によるものと 考えられている。

§ 6. Pt- 電極の吸着による光の 反射率の変化

硫酸溶液内で, Pt 電極上の水素 の吸着による反射率の変化から,水 素がミクロスコピックにどのような 状態で吸着しているかが分る。

BewickとTuxford³²⁾は,1モル の硫酸溶液中で反射率Rと電極のポ テンシャルEとの関係を求めた。光 の波長は、3,000Å~5,000Åで入 射面に垂直に偏光したs-偏光及び 偏光面が入射面内にあるp-偏光を 用いた。図19には、波長が4400Å



図19 上の曲線は各電圧に対する反 射率の変化,下の曲線は電極電 流曲線。領域1,2,3,はそれぞれ 二重層領域,strongly-boundhydrogen 領域,weakly-bound-hydrogen 領域に対応する。 入射角 45° の s - 偏光の例をあげる。 + 535mVから - 6 m Vまで linear に減少 し,再び+535mVに戻る cyclic voltametric methodで,1024 回積算したも のである。横軸に Eを,縦軸には電極を流 れる電流と, $\frac{1}{R}\frac{\partial R}{\partial E} \times 10^{-4}$ が与えられて いる。

+ 535mV --- + 380mVまでと, + 380mV --- + 187mVまでと, + 187mV --- + 58mVまでの

三つの領域にわかれている。それぞれ1,2, 3領域と呼ぶ。第一の領域では、小さくほ とんど一定の負の電流、即ち、溶液からPt 白金電極の方向の電流が流れる。この領域 では、溶液中の水和した水素イオン(陽子)が電極面に溜って二重層をつくる過程で、

この二重層は所謂Helmhaltzの double lager と呼ばれるものである。この領域では, $R^{-1} \partial R / \partial E$ は負である。

2,3の領域は,水素の吸着がおこる領域で,まず吸着のおこる2では,3の水素より 吸着エネルギーが大きい故,2を strongly - bound - hydrogen (H_s) region, 3を weakly - bound - hydrogen (H_w) region と呼んでいる。

 H_w^- 領域は,普通の吸着層の特徴と同じで, $R^{-1} \frac{\partial R}{\partial \theta}$ は常に負で, その大きさは 波長が小さくなると増大する。しかし, H_s^- 領域では異常で, $R^{-1} \frac{\partial R}{\partial \theta}$ は正で, その 大きさは波長が長くなると大きくなる。

Bewick と Tuxford は, metal/adsorbed layer/solution の三重層モデルについて 多くの数値計算をした結果, n, k を refraction index の実数及び虚数部分とすると,

 $n_{lager} \approx n_{metal}$

* 被覆率 θ は電流から容易に算出できる。



図20 (a)と(b)は白金の n_{metal}, k_{metal}と波 長の関係。 (c)と(d)は,白金上にstrongly-bound-hydrogen layer がで きたときのn, k_と波 長の関係

$$k_{layer} > k_{metal}$$

でなければ、観測されるような異常はおきないことを結論し、観測結果と一致するよう に n_{layer} と k_{layer} との値を reflectance equation を解いて求めた。吸着層の厚さは $n_{metal} - n_{layer}$, $k_{metal} - k_{layer}$ が厚さに比例することから、1Å であると結論した。

図 2 0には、かくの如く決められた n_{layer} 及び k_{layer} の値をあげる。実線の(a)及び (b)が白金の n_{metal} 及び k_{metal} で、Barett と Parson³³⁾の求めたものを使った。 興味 あることは、 n_{layer} は n_{metal} に近いが、 k_{layer} は k_{metal} よりかなり大きくなってい ることである。

以上のことから, Bewick とTuxfordは, H_s^- 領域の吸着は, s -型の吸着であると 結論をしている。 H_w^- 領域の吸着は, normal で, 水素が少し負(-0.02e)に分極 しているものである。図21および図22に二重層の $R^{-1}\partial R/\partial E$, $R^{-1}\partial R/\partial \theta$ および $R^{-1}\partial R/\partial E$ の波長の関数としての観測値および計算値を示す。計算値は測定値をよく 再現していることが分る。図23は H_w^- 領域の $R^{-1}\partial R/\partial E$ を示す。



図21 double - layer領域での波長 による R⁻¹ ∂R ∂E の変化
(1) 45°, p- 偏光
(2) 45°, s- 偏光
(3) 70°, p- 偏光
(4) 70°, s- 偏光





図23 weakly - bound - hydrogen 領域での波長による R⁻¹ ∂R ∂θ の変 化。(1)45°, p - 偏光 (2)45°, s - 偏光 (3)70°, p - 偏光 (4)70°, s - 偏光

§7. 吸着水素のNMR

r -型の吸着は,原子間の分子力と同じ性質のものと考えられるから,陽子のNMR においては bare の陽子の共鳴からのずれは小さいことが予想される。即ち,一定の波 数のマイクロウェープに対し,共鳴吸収をおこす磁場H₀からのずれ dHは, $\left|\frac{dH}{H}\right| \leq 10^{-3}$ %位であろう。これに反し,s-型の吸着では,陽子は金属電子内にあるために, Knight effectによる shift がおこり, $\left|\frac{dH}{H_0}\right| \geq 10^{-3}$ %であることが期待される。 T. Ito et.al. は,白金,³⁴ 銅³⁵⁾タングステン³⁶⁾に吸着した水素のNMRを測定し,

T. Ito et.al. は、白金³⁴⁾ 銅³⁵⁾タングステン³⁶⁾に吸着した水素のNMRを測定し、 共鳴吸収の微分曲線は shift の異なる二つの吸収線からなり(図24,25,26,27,28,29参 照)、その shift は、次の如く与えられることを見出した。即ち、 shift には $\frac{4H}{H}$ を用 いると

	Chemical shift (r-type adsorption)	Knight shift (s - type adsorption)
H/P t	$0 \sim -0.001\%$ ($4 \sim 6 \text{ kcal/mole}$)	-0.004% (0.5kcal/mole)
H/W	0.001% (2.2kcal/mole)	-0.005%
H/Cu	~ 0	+ 0.01% (0.7kcal/mole)



図24 H/PtのNMR (233 $K \ge 271 K$)



図25 H/PtのNMR (301 °K と 330 °K)



図26 301°Kの signal (図25)を line a と b とに分解したもの



図27 H/Ptの狭いほうの吸収幅のアレニウス・プロット



図28 H/WのNMR

(347°K,429°Kと470°K)



図29 H/Wの429°Kの signal を line AとBとに分解したもの

吸収線の幅を微分曲線の peak to peak の δH_{p-p} で表わすと、その大きさは温度を 上げると次第に狭くなる。これは表面を吸着原子がmigrateするためのmotional marrowing と考えられる。この narrowingより migration の活性化熱 E_kcal/mole を求めると上記の表の括弧内に示した値を得る。 r-type の吸着原子の E_a は 2 ~ 6 k cal/mole であるのに、s-type のものは 0.5 ~ 0.7 k cal/mole である。s-type の 吸着は, poor absorber に吸収された水素と同じように,水素が陽子と電子に解離し, 電子は金属の伝導帯に入り,陽子は伝導電子により shieldされる。このような陽子は、 bulk 内ではかなり自由に migrate できるので、これが表面にある s-型の吸着原子で は、 $E_a < 1$ kcal/mole は容易に理解できる。 r - type の吸着原子の E_a は s - 型のも のに比べるとかなり大きい。尚, タングステンの s - 型は, 電気抵抗の吸着による変化 からも,また,タングステンは殆ど水素を吸収せず,吸収熱が 30 kcal/male の吸熱で あることから、測定された温度領域では容易に脱離がおこり、吸着している平均寿命が 10^{-8} sec よりはるかに小さいためであろう。(図30)また,銅の吸着率は小さく θ <10⁻¹ 位で, shift 零に近い共鳴線の幅は殆ど温度変化をしていない。これは測定装 置内の impurity としての水素原子によるものと考えられ、 r 一型吸着原子であっても 観測にかからないためであろう。(図31,32)

H/Cuの 4.2 °K での共鳴吸収線は図33に示すように $H_0 = 8.000 \text{ gauss}$, $\delta H_{p-p} = 5 \sim 7 \text{ gauss}$ である。この幅は Pt やWでは、陽子間の磁気的相互作用が主なものであるが、 C_u 原子の核磁気能率は大きく、水素の吸着は小くないので、幅の主な原因は

-C131-



図30 H/Wの狭い line の吸収幅の温度変化



図 3 1 H/CuのNMR(173°Kと303°K)



図32 H/Cuのshiftの大きな吸収線の線幅の温度変化



図 3 3 H/Cuの 42°Kの NM R

Cu の核磁気の fluctuation による。即ち,

$$\varDelta H_{p-p} \approx 2 \ \sqrt{M_2}$$

で, M_2 は局所磁場の fluctuation の second moment で,

$$M_2 = \frac{3}{5} r^2 \pi^2 I (I+1) \Sigma \frac{1}{r^6}$$

で与えられる。rは gyrom agnetic ratio , I は核スピン, rは吸着原子と C_u 原子の距離で,和は全ての C_u 原子についてとることを意味する。これより図34を参照に



図34 H/C_uの吸収幅と吸着水素原子の位置関係

して、陽子の位置は、最も外側の C_u 原子の層から、ほぼ 0.7 Å 外側の所に、平衡位置があることになる。これは、はじめに予想されていた値と一致する。

REFERENCES

- 1) J. Bardeen, Phys. Rev., 49, 654 (1936).
- J. Horiuti and T. Toya, Solid State Surface Science (M. Dekker, Inc. N. Y., 1969) Vol. 1, Chapter 1, p. 1.
- 3) R. Smoluchowski, Phys. Rev., 60, 661 (1941).
- J. C. Riviere, Solid State Surface Science (M. Dekker, Inc. N. Y., 1969) Vol. 1, Chapter 4, p. 213.
- 5) I. Tamm, Physik Z. Sowjet., 1, 773 (1932).
- 6) W. Schockley, Phys. Rev., 56, 317 (1939).
- 7) C. A. Coulson and G. R. Baldock, Disc. Faraday Soc., 8, 27 (1950).
- J. Koutecky, Trans. Faraday Soc., 54, 1038 (1958); J. Phys. Chem. Solids, 14, 237 (1960).
- T. B. Grimley, Proc. Phys. Soc., 72, 103 (1958); J. Phys. Chem. Solids, 14, 227 (1960).
- 10) J. W. Gadzuk, J. Vac. Science and Tech., 9, 591 (1971).
- 11) E. W. Plummer and A. E. Bell, J. Vac. Science and Tech., 9, 583 (1971).
 J. W. Gadzuk and E. W. Plummer, Rev. Modern Phys., 45, 487 (1973).
- H. D. Hangstrum, Proc. 2nd Int. Conf. on solid Surfaces, Kyoto, 1974. Japanese
 J. Appl. Phys. Suppl. 2, 11 (1974).
- 13) B. Feuerbacher and B. Fitton, Phys. Rev. Lett., 30, 923 (1973).
- 14) E. W. Plummer and J. W. Gadzuk, Phys. Rev. Lett., 25, 1493 (1970).
- 15) J. B. Pendry and F. Forstmann, J. Phys. C: Proc. Phys. Soc., London 3, 59 (1970); F. Frostmann, Z. Phys., 235, 69 (1970).
- 16) N. F. Christensen and B. Feuerbacher, Phys. Rev., B10, 2349 (1974).
- 17) B. Feuerbacher and B. Fitton, Phys. Rev. Lett., B8, 4890 (1973).
- 18) B. Feuerbacher and M. R. Adriaens, Surf. Science, 45, 553 (1974).
- 19) D. M. Newns, Phys. Rev., 178, 1123 (1969).
- 20) P. W. Anderson, Phys. Rev., 124, 41 (1961).
- 21) T. Toya, J. Res. Inst. for Catalysis, Hokkaido Univ., 6, 308 (1958).

-C135-

戸谷富之

- 22) T. Toya, J. Res. Inst. for Catalysis, Hokkaido Univ., 8, 209 (1960).
- 23) J. Bardeen, Phys. Rev., 58, 727 (1940); H. Margenau and W. G. Pollard, Phys. Rev., 60, 128 (1941).
- 24) J. R. Schrieffer and R. Gomer, Surf. Science, 25, 315 (1971); R. H. Paulson and J. R. Schrieffer, Surf. Science, 48, 329 (1975).
- 25) S. K. Lyo and R. Gomer, Phys. Rev., B10, 4161 (1974).
- 26) J. Kanamori, K. Terakura and K. Yamada, Prog. Theor. Phys., 41, 1426 (1969).
- 27) D. R. Penn, Phys. Rev., B9, 839 (1974); Surface Science 39, 333 (1973).
- 28) N. D. Lang and A. R. Williams, Phys. Rev. Lett., 34, 539 (1975); to be published.
- 29) W. Kohn and L. J. Sham, Phys. Rev., 140, A1133 (1965).
- 30) R. Suhrmann, G. Wedler and H. Gentsch, Zeit. f. Physik. N. F. 17, 350 (1958);
 R. Suhrmann et. al., ibid., 12, 128 (1957); 20, 332 (1959).
- 31) Y. Mizushima, J. Phys. Soc. Japan, 15, 1614 (1960).
- 32) A. Bewick and A. M. Tuxford, Electroanalytical Chem., 47, 255 (1973).
- 33) M. A. Barret and R. Parsons, Symp. Faraday Soc., 4, 72 (1970).
- 34) T. Ito, T. Kadowaki and T. Toya, Proc. 2nd Int. Conf. on Solid Surfaces, Kyoto, 1974, Japanese J. Appl. Phys. Suppl. 2, Pt. 2, 257 (1974).
- 35) T. Ito and T. Kadowaki, Japanese J. Appl. Phys., 14, 1673 (1975).
- 36) T. Kumagai, T. Ito and T. Kadowaki, to be published.